

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公開番号】特開 2006-133026 (P2006-133026A)
 【公開日】平成 18 年 5 月 25 日 (2006.5.25)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-020
 【出願番号】特願 2004-320771 (P2004-320771)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 21/956 (2006.01)
G 0 1 N 21/88 (2006.01)
G 0 3 F 1/08 (2006.01)
H 0 1 L 21/66 (2006.01)
H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/956 A
 G 0 1 N 21/88 H
 G 0 3 F 1/08 S
 H 0 1 L 21/66 J
 H 0 1 L 21/30 5 0 2 V

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 5 月 23 日 (2007.5.23)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】手続補正書
 【補正対象項目名】手続補正 1 3
 【補正方法】追加
 【補正の内容】
 【手続補正 1 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 2 1】

【図 1】本発明による外観検査装置の一例を示す概略図。
 【図 2】本発明による光学系レイアウトを示す図。
 【図 3】従来技術における光学系レイアウトを示す図。
 【図 4】欠陥検査装置光学系の構成例を示す図。
 【図 5】欠陥検査装置における光路分離部の構成例を示す図。
 【図 6】本発明による外観検査装置の他の例を示す概略図。
 【図 7】本発明による外観検査装置の他の例を示す概略図。
 【図 8】図 1 の変更ビームスプリッタに関する補足説明図。